



MX0400311

4SB5

**Caracterización de un detector de silicio de doble cara (DSSD) para su utilización en sistemas de detección de radiaciones ionizantes.** R. Macías, A. Huerta, E. Chávez, M. E. Ortiz, Instituto de Física Universidad Nacional Autónoma de México Ciudad Universitaria México DF . C.P. 04510 Coyoacan México.

En el presente trabajo se describen la características de los detectores de silicio del tipo Double Sided Strip Detector (DSSD), así como las aplicaciones fundamentales de los mismos. Se hace énfasis en el proceso de caracterización de un detector DSSD de 32 "canales" mediante su conexión a un circuito preamplificador. Se describe el circuito utilizado en la caracterización y se muestran los resultados obtenidos, realizándose las recomendaciones necesarias para su aplicación en los diferentes sistemas de adquisición. Se hace referencia también a los sistemas electrónicos que serán desarrollados como soporte a este tipo de detector y a las ideas y proyectos que se están desarrollando en el Instituto de Física de la UNAM al respecto.

El presente trabajo fue apoyado por el proyecto DGAPA 111102